(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月10 日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/012384 A1

(51) 国際特許分類7:

C08G 59/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009439

(22) 国際出願日:

2004年7月2日(02.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-284424 2003 年7 月31 日 (31.07.2003) JP 特願2004-071349 2004 年3 月12 日 (12.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番1号 Tokyo (JP).

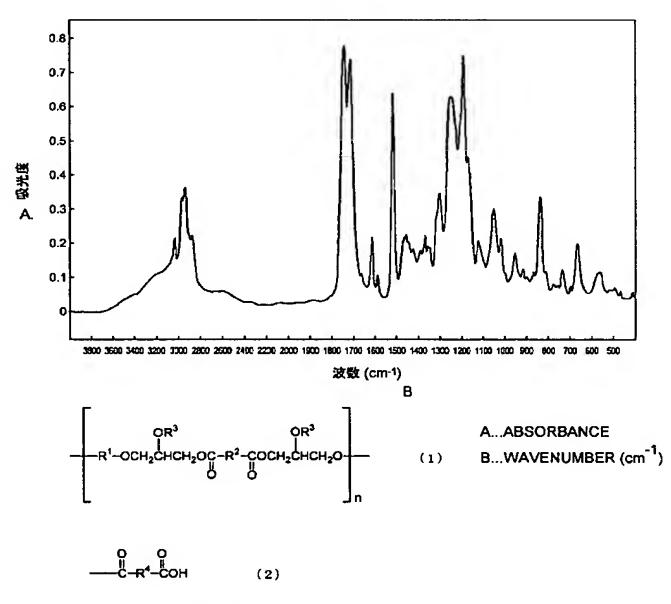
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板垣 秀一 (ITA-GAKI, Shuuichi) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3番 1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 土屋 勝則 (TSUCHIYA, Katsunori) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3番 1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 吉田 哲也 (YOSHIDA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3番 1号日立化成工業株式会社 山崎事業所内 Ibaraki (JP). 塚田 勝重 (TSUKADA, Katsusige) [JP/JP]; 〒3178555 茨城県日立市東町四丁目 1 3番 1号日化テクノサービス株式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0 番 6 号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: MODIFIED EPOXY RESIN, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITIONS AND PHOTOSENSITIVE ELEMENTS

(54) 発明の名称: 変性エポキシ樹脂、その製造方法、感光性樹脂組成物及び感光性エレメント



(57) Abstract: A modified epoxy resin having repeating units represented by the general formula (1): wherein R¹ is a divalent organic group which is a residue derived from a diglycidyl ether-type epoxy compound; R² is a divalent organic group which is a dibasic acid residue; R³ is hydrogen or a group represented by the general formula (2): (wherein R⁴ is an acid anhydride residue); and n is an integer of 1 or above.

l(57)要約: 下記一般式(1);【化1】〔式中、R¹はジグリシジルエーテル型エポキシ化合物残基である二価 の有機基を示し、R²は二塩基酸残基である二価の有機基を示し、R³は水素原子或いは下記一般式(2);【化 2】(式中、R⁴は酸無水物残基を示す。)で表される基を示し、nは1以上の整数を示す。〕で表される繰り 返し単位を有する変性エポキシ樹脂。



WO 2005/012384 A1

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \neg \nu \wedge l$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(12) ƒ 許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日 2005 年2 月 10 日 (10.02.2005)

(10) 国 WO 2005/012384 A1

(51) 国際特許分類7:

C08G 59/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/009439

(22) 国際出願日:

2004 年7 月2 日(02 07 2004)

(25) 国際出願の言語:

日木語

(26) 国際公開の言語:

日木語

(30) 優先権子一タ:

特願 2003-284424 2003 年7 月31日 (31 07 2003) 特願 2004-071349 2004年3月12日(12032004)

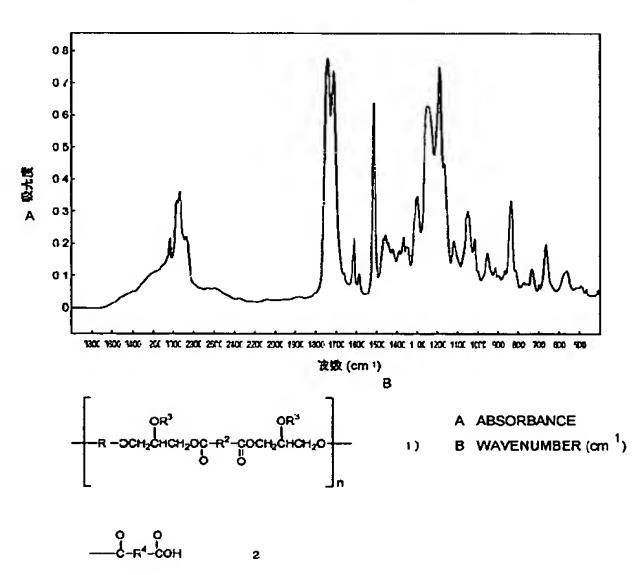
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化 成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO. LTD.) [JP/JP], 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 T 目 1 番 1号 Tokyo (JP)

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 板垣 秀― (ITA-GAKI, Shuuichi) [JP/JP], 〒3178555 茨城県 日立市東 町四丁目13番1号日立化成工業株式会社 山崎事業 所内 Ibaraki (JP) 土屋 勝則 (TSUCHIYA, Katsunori) [JP/JP], 〒3178555 茨城県 日立市東町四丁目13番 1号 日立化成工業株式会社 山崎事業所内Ibaraki (JP) 吉田哲也 (YOSHIDA, Tetsuya) [JP/JP], 〒3178555 茨 城県日立市東町四丁目13番1号日立化成工業株式 会社 山崎事業所内Ibaraki (JP) 塚田勝重 (TSUKADA, Katsusige) [JP/JP], 〒3178555 茨城県日立市東町四丁 目13番1号日化テクノサービス株式会社内 naraki (JP)

[続葉有]

(54) Title: MODIFIED EPOXY RESIN, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSI-TIONS AND PHOTOSENSITIVE ELEMENTS

(54) 発明の名称:変性エポキシ樹脂、その製造方法、感光性樹脂組成物及び感光性エレメント



(57) Abstract: A modified epoxy resin having repeating units represented by the general formula (1) wherein R¹ is a divalent organic group which to a residue derived from a diglycidyl ether-type epoxy compound, R is a divalent organic group which is a dibasic acid residue, R to hydrogen or a group represented by the gener formula (2) (wherein R is an acid anhydπde residue),

organic group wall dibasic acid residue, R³ to hydrogen or a group representation and n is an integer of 1 or above

(57) 要約: 下記一般式 (1) , 【化 1】 〔式中、R¹ はジグリシジルエーテル型エポキシ化合物残基である二価の有機基を示し、R² は二塩基酸残基である二価の有機基を示し、R³ は水素原子或いは下記一般式 (2) , 【化 2】 (式中、R⁴ は酸無水物残基を示す。)で表される基を示し、n は 1以上の整数を示す。〕で表される繰りでは、 2 単位を有する変性エポキシ樹脂。

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹 , 外(HASEGAWA, Yoshiki et tal.); 〒1cm0061 東京都中央区銀座一丁 目 1 0 番 6 号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, Cの, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FT, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, Nø, NZ, øM, PG, PH, PL, PT, Rø, RU, _C, _D, _E, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) 指定国俵 示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -xーラシT (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ョーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FT, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, Im_, PL, PT, Ro, _E, _1, _K, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公 開書類:

- 国際調査報告書
- (48) この訂正版の公開日.

2006年1月26日

(15) 訂正情報: PCTガゼットセクションIIのNo.cm/2006 (2006 年1月 26日)を参照

2 文字 $_{\Box}$ ード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼ $_{\Box}$ トの巻頭に掲載されている「 $_{\Box}$ ードと略語のガイダンス $_{\Box}$ ート $_{\Box}$ を参照。